

外観検査アルゴリズムコンテスト 2021

<http://www.tc-iaip.org/alcon/>

主催 公益社団法人 精密工学会 画像応用技術専門委員会
共催 国立研究開発法人 理化学研究所 ボクセル情報処理システム研究チーム

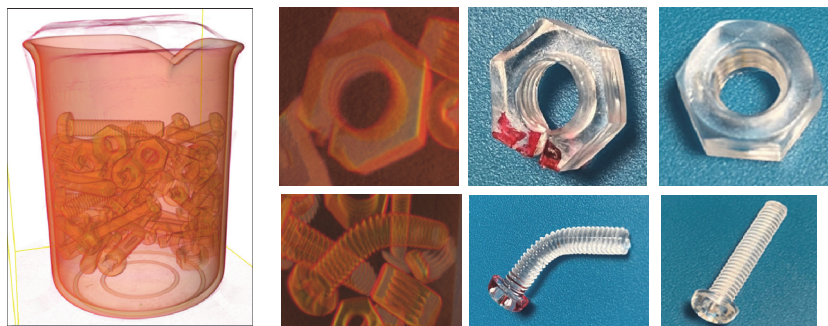
趣旨 画像応用技術専門委員会では、画像を用いた外観検査技術の発展を図るため、研究者・技術者が共通で使える外観検査画像データベースの構築を進めつつ、その一環として外観検査アルゴリズムコンテストを2001年より実施しております。お陰様で実際の製造現場等で生じる画像をそのまま使用した他に例を見ないユニークなコンテストとして広く認知されるようになり、ここ数年は参加者数が約150名となっております。さて第20回の今回は、理化学研究所ボクセル情報処理システム研究チームと共催で、工業製品を対象とした「X線CTによる工業製品の内部検査～ボクセルデータからの欠陥検出～」アルゴリズムのコンテストを実施することになりました。

優秀作品は12月開催のViEW2021（ビジョン技術の実利用ワークショップ）で表彰致します。検査画像のサンプルと詳しい応募要領は6月末にwebsiteで公開致しますので、ご覧ください。皆様の挑戦をお待ち致しております。

課題 「X線CTによる工業製品の内部検査～ボクセルデータからの欠陥検出～」

応募要領 詳細発表 2021年6月25日(金)
エントリー 締め切り 2021年8月6日(金)
プログラム 締め切り 2021年10月1日(金)

表彰内容 検出の正解率と処理時間をもとに、最優秀賞(1件)、優秀賞(2件)、特別賞(1件)、学生奨励賞(1件)を表彰します。さらに成績が良く、産業界において価値が高いと判断されたアルゴリズムに、理研ボクセル大賞(1件)、理研ボクセル賞(若干件)を授与します。



データ提供：理化学研究所
左から
工業製品のボクセルデータ
欠陥品のボクセルデータ
欠陥品及び良品の外観画像

実行委員 寺田賢治(委員長：徳島大)、横田秀夫(幹事：理研)、大橋剛介(幹事：静岡大)、青木公也(中京大)、伊藤誠也(日立製作所)、大西浩之(SCREENホールディングス)、加藤邦人(岐阜大)、竹本智子(理研)、野村安國(ディスコ)、橋本学(中京大)、林純一郎(香川大)、藤原伸行(明電舎)、堀修(東芝)、松林毅(理研)、松原琢磨(中京大)、三和田靖彦(理研・YYCソリューション)、吉澤信(理研)、脇谷康一(パナソニック)

テクニカルアドバイザー 浅野敏郎(広島工大)、梅田和昇(中央大)、榎澤信(AGC)、広瀬修(住友化学)、奥水大和(顧問：中京大・YYCソリューション)

問い合わせ先 画像応用技術専門委員会「外観検査アルゴリズムコンテスト」事務局
〒169-0073 新宿区百人町2-21-27 アドコム・メディア(株)内
TEL: 03-3367-0571 e-mail: iaip@adcom-media.co.jp

外観検査アルゴリズムコンテスト2020：最優秀賞 水谷麻紀子殿(みずほ情報総研) 優秀賞 菅野純一殿(ヴィスコ・テクノロジーズ) / 田中大貴殿 檜作彰良殿 平田悠人殿 中山良平殿(立命館大) 学生奨励賞 中井康補殿 大藪達也殿(静岡大)
理研ボクセル大賞 水谷麻紀子殿(みずほ情報総研) 理研ボクセル賞 菅野純一殿(ヴィスコ・テクノロジーズ) / 田中大貴殿 檜作彰良殿 平田悠人殿 中山良平殿(立命館大) / 中井康補殿 大藪達也殿(静岡大)